НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Ігоря СІКОРСЬКОГО» ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Протокол до лабораторної роботи ДИФРАКЦІЯ В ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОМЕНЯХ ТА ПРИНЦИП НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Виконали студенти групи ФІ-81

Кармазін А.О. Корешков М.О. Прохоренко О.С. Шкаліков О.В.

> Перевірив: Долгошей В.Б.

Теоретична частина

Хвильова природа світла найбільш яскраво спостерігаєтьтся в явищі дифракції, тобто в явищі огинання світлом перешкод(екранів, отворів).

Розглянемо пучок паралельних монохроматичних променів з довжиною хвилі λ , що падають на щілину шириною b(рис. 1). Площину щілини можна розбити на ряд вузеньких паралельних смужок однакової ширини. Кожну з таких смужок будемо розглядати як джерело хвиль, причому фази і амлітуди всіх цих хвиль однакові, оскільки за нормального падіння площина щілини збігається з поверхнею хвилі. Для розрахунку інтенсивності в різних напрямках напишемо вираз хвилі, що посилає кожний елемент хвилі товщини dx, і підсумуємо дію всіх елементів. Амплітуда хвилі, зумовлена таким елементом, очевидно,

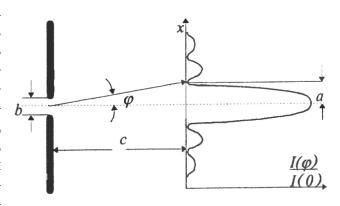


Рис. 1: Дифракція в паралельних променях

пропорційна dx, а відповідне збурення дорівнює

$$dE = \frac{A_0}{b} dx \cdot e^{i\omega t},\tag{1}$$

де ω - циклічна частота, A_0 - сумарна амплітуда хвилі, що посилає вся щілина. В напрямку спостереження всі елементарні хвилі будуть мати однакову фазу, і тому результуюча амплітуда буде $E=A_0$. Для хвиль, що розповсюджуються під кутом φ до напрямку спостереження, треба врахувати різницю фаз, яка характеризує хвилі, що приходять від різних елементів щілини. З геометричних міркувань зрозуміло, що різниця ходу для елементу, що знаходиться на відстані x від краю щілини, дорівнює $x \sin \varphi$. Відповідне елементарне світлове збурення

$$dE = \frac{A_0}{h} dx \cdot e^{i(\omega t - kx \sin \varphi)},\tag{2}$$

де $k=\frac{2\pi}{\lambda}$ - хвильове число. Отже, результуюче збурення

$$E = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} dE = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{A_0}{b} dx \cdot e^{i(\omega t - kx\sin\varphi)} dx = A_0 \frac{\sin\left(\frac{bk}{2}\sin\varphi\right)}{\frac{bk}{2}\sin\varphi} e^{i\omega x},\tag{3}$$

а інтенсивність у вказаному напрямку

$$I(\varphi) = I(0) \left[\frac{\sin\left(\frac{bk}{2}\sin\varphi\right)}{\frac{bk}{2}\sin\varphi} \right]^2 = I(0) \left[\frac{\sin u}{u} \right]^2, \ u = \frac{bk\sin\varphi}{2}$$
 (4)

Формулу 4 називають формулою Кірхгоффа. З цієї формули видно, що за певних кутів спостереження φ_n , а саме

$$\sin \varphi_n = \frac{n\lambda}{h}, \ n = 1, 2, \cdots \tag{5}$$

інтенсивність дорівнює нулю, що відповідає темним смугам на екрані. Крім того, між мінімумами знаходяться максимуми. Їх положення визначається умовою рівності нулю похідної від 3:

$$\frac{d\left(\frac{\sin u}{u}\right)}{du} = 0,\tag{6}$$

де и - розв'язок трансцендентного рівняння

$$tan u = u \tag{7}$$

для перших трьох максимумів буде:

$$\frac{bk}{2}\sin\varphi = 0, \quad \frac{bk}{2}\sin\varphi = 1.43\pi, \quad \frac{bk}{2}\sin\varphi = 2.46\pi$$

$$\frac{bk}{2}\sin\varphi = 3.47\pi, \quad \frac{bk}{2}\sin\varphi = 4.47\pi$$
(7A)

Величина інтенсивності в цих максимумах тим менша, чим більший номер максимуму. Відношення інтенсивністей наближено можна виразити рядом:

$$1: \left(\frac{2}{3\pi}\right)^2: \left(\frac{2}{5\pi}\right)^2: \left(\frac{2}{7\pi}\right)^2: \cdots \tag{8}$$

Таким чином, за умов коли паралельний монохроматичний когерентний світловий промінь проходить через щілину, на екрані розташованому за щілиною виникає дифракційна картина з головними та додатковими максимумами.

Розглянемо тепер дифракцію від двох паралельних щілин. Дві дифракційні картини від кожної з щілин накладуться одна на одну. При цьому треба прийняти до уваги взаємну інтерференцію хвиль, що ідуть від першої та другої щілини. Очевидно, що в тих напрямках, куди ні одна з щілин не посилаж світла, не буде світла і при двох щілинах. Тобто, мінімуми інтенсивності залишаються на старих місцях Окрім того, з'являються нові мінімуми, оскільки існують напрямки, в яких коливання від відповідних точок двох щілин взаємно знищую-

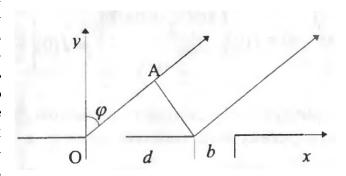


Рис. 2: Дифракція від двох щилин

ться. Це напрямки, для яких різниця ходу від відповідних точок двох щілин становить $\frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2} \cdots$. Як видно з рис. 2 такі напрямки визначаються умовою

$$OA = d \cdot \sin \varphi = \frac{1}{2}\lambda, \frac{3}{2}\lambda, \cdots$$
 (9)

В напрямках, що визначаються умовами

$$d \cdot \sin \varphi = \lambda, 2\lambda, \cdots \tag{10}$$

дія щілин підсилюється, а отже в цих напрямках з'являються максимуми. Узагальнюючи вищесказане можна зробити висновок, що повна дифракційна картина від двох щілин визначається такими умовами:

колишні мінімуми
$$b \cdot \sin \varphi = \lambda$$
, 2λ , 3λ , \cdots додаткові мінімуми $d \cdot \sin \varphi = \frac{1}{2}\lambda$, $\frac{3}{2}\lambda$, $\frac{5}{2}\lambda \cdots$ (11) головні максимуми $b \cdot \sin \varphi = 0$, λ , 2λ , \cdots

Міркування, наведені для двоз щілин, залишаються слушними для випадку N щілин, тобто дифракційної решітки - екрана з регулярною структурою, наприклад довгими і вузькими щілинами з паралельними краями. Додаткові мінімуми з'являються за рахунок інтерференції випромінювання від першої щілини з випромінюванням від другої, третьої і далі до (N-1). Умова 11 перепишеться як:

колишні мінімуми
$$b \cdot \sin \varphi = \lambda$$
, 2λ , 3λ , \cdots додаткові мінімуми $d \cdot \sin \varphi = \frac{1}{N}\lambda$, $\frac{2}{N}\lambda$, \cdots , $\frac{N-1}{N}\lambda$ \cdots (12) головні максимуми $b \cdot \sin \varphi = 0$, λ , 2λ , \cdots

Отримаємо аналітичний вираз для розподілу інтенсивності від N щілин. Напруженість поля від першої щілини в напрямку φ описується формулою 3. Для хвиль, що дифрагують на другій, третій і далі щілині, напруженість буде відрізняться фазовим множником:

$$E_N(\varphi) = E_1(\varphi) \cdot e^{i(N-1)\delta}, \ \delta = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \varphi$$
 (13)

Тоді, результуючі напруженість та інтенсивність від усіх щілин буде:

$$E_{P}(\varphi) = E_{1}(\varphi) \left[1 + e^{i\delta} + e^{2i\delta} + \dots + e^{i(N-1)\delta} \right]$$

$$I(\varphi) = E \cdot E^{*} = I(\varphi) \frac{\sin^{2} \frac{N\delta}{2}}{\sin^{2} \frac{\delta}{2}}$$
(14)

З 14 видно, що для напрямків, в яких різниця фаз $\frac{\delta}{2}=m\pi(m=0,\pm 1,\pm 2,\cdots)$ інтенсивність випромінювання зростає у N^2 разів, тобто ці напрямки відповідають головним максимумами в дифракційній картині, як і витікає з умов 12. Ширина головних максимумів ε на половині висоти визначається з умови

$$\frac{\sin^2 \frac{N\delta_{\frac{1}{2}}}{2}}{\sin^2 \frac{\delta_{\frac{1}{2}}}{2}} = \frac{N^2}{2},$$

де $\delta_{\frac{1}{2}}=m\pi\pm\frac{\varepsilon}{2}$ Рішення цього трансцендентного рівняння дає $\varepsilon=\frac{5.6}{N}$. Щільність дифракційної картини - відношення відстані між головними максимумами до Їх ширини - буде дорівнювати:

$$F = \frac{\Delta \delta}{\varepsilon} = 1.13N \tag{15}$$

Тобто різкість дифракційної картини пропорційна загальній кількості щілин(штрихів) дифракційної решітки.

Розглянемо тепер явище дифракції з точки зору кванотової механіки. Згідно з принципом невизначенності Гейзенберга неможливо одночасне точне визначення значень спряжених змінних, таких як координата x та імпульс p в один і той же момент часу, або в аналітичному вигляді

$$\Delta x \cdot \Delta p \ge \frac{\hbar}{4\pi} \tag{16}$$

де $\Delta x,\,\Delta p$ - похибки у визначенні координати та імпульсу, відповідно, $\hbar=6.6262\cdot 10^{-34}$ Дж \cdot сек - стала Планка.

Розглянемо, для прикладу, сукупність фотонів, ймовірність знаходження яких у просторі описується функцією f_x , а розподіл імпульсів - функцією f_p d. Якщо фотони проходять крізь щілину завширшки d, то поперек щілини їх координата визначена з точністю

$$\Delta x = d \tag{17}$$

Густина ймовірності для відповідної компоненти імпульсу визначається розподілом інтенсивності в дифракційній картині. Справді, інтенсивність пропорційна кількості фотонів, що прийшли в задане місце протягом певного часу, отже, невизначенність імпульсу пропорційна відстані між мінімумами дифракційної картини, тобто

$$\Delta p_x = p_0 \sin \varphi, \tag{18}$$

де p_0 - початковий імпульс. Застосовуючи співвідношення Де-Бройля $p=\frac{h}{\lambda}$ і підставляючи відстань між мінімумами з формули 12 отримуємо

$$\Delta p_x = \frac{h}{\lambda} \sin \varphi = \frac{h}{d} \tag{19}$$

Порівнюючи 17 та 19 бачимо, що користуючись щілиною для визначення координати фотона (локалізації його у просторі з точністю d), ми спотворюємо точність визначення імпульсу таким чином, що

$$\Delta x \Delta p = h$$

Отже, дифракція може розглядатися як один з проявів фундаментального принципу невизначенності 16.

Хід роботи

- 1. Виміряти координати максимумів та відстань від градки до екрана
- 2. Знайдіть період кожної з досліджуваних градок

Практична частина

У результаті виконання роботи, були отримані наступні дослідні дані(L(cm) - відстань до лазера), x - координата відповідного максимуму

Градка	n	L(см)	х(см)	
1	1	66.5	1.1	
	2		2.2	
	3		3.3	
	4		4.3	
	5		5.4	
	6		6.5	
2	1	21.2	3.7	
	2		3.8	

Табл. 1: Дослідні дані

З формули 10 визначимо період градки:

$$d = \frac{n\lambda}{\sin \varphi_n} = \frac{n\lambda}{\sin \arctan \frac{x_n}{L}}$$

Градка	n	$\sin \varphi$	d(MKM)	$\langle d \rangle$ (MKM)	
1	1	0.017	38		
	2	0.033	38		
	3	0.05	38	38.5	
	4	0.064	39		
	5	0.081	39		
	6	0.097	39		
2	1	0.172	4	5.5	
	2	0.176	7		

Табл. 2: Результати обчислень

Знаючи значення $\lambda=632*10^{-9} ({\rm M})$ отримаємо наступні значення періоду град-ки(таблиця 2)

Похибки вимірювань обчислимо як стандартне відхилення середнього арифметичного:

$$\Delta d = |\langle d \rangle - d_i|$$

$$\Delta \langle d \rangle = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta d_i^2}{n(n-1)}}$$

Градка	n	$\Delta d(\mathbf{mkm})$	$\Delta \langle d \rangle$ (MKM)	$\varepsilon_{\langle D \rangle}\%$
1	1	0.44		0.44
	2	0.42		
	3	0.39	0.17	
	4	0.52	0.17	
	5	0.39		
	6	0.33		
2	1	1.4	1.23	22
	2	1.6	1.20	<u> </u>

Табл. 3: Похибки

Висновки

Ми ознайомились з явищем дифракції за допомогою лазера та дифракційної градки. У результаті виконанання лабораторної роботи нами було обраховано періоди дифракційних градок. Знайдені числові значення наведені у таблиці 2. Похибки вимірювань зазначені у таблиці 3. Їх можна пояснити неправильним налаштуванням обладнання та людським фактором.

Відповіді на контрольні питання

- 1. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- 2. Що таке дифракція? Чим відрізняється дифракція Фраунгофера від дифракції Френеля? Критерій дифракції Фраунгофера.

- 3. Що таке дифракційна гратка і якими параметрами вона характеризується?
- 4. Як залежить ширина головного максимуму та інтенсивність від ширини щілини?
- 5. Як залежить ширина головного максимуму та інтенсивність від відстані між щілиною та екраном при сталій ширині щілини?